自作断熱消磁冷凍機を用いた TES型X線カロリメータの開発

海道 司 (金沢大学大学院 自然科学研究科 数物科学専攻 修士1年)

Abstract

X 線マイクロカロリメータは入射光子1つ1つのエネルギーを素子の温度上昇として計測する検出器で, 0.1 K 以下の極低温で優れたエネルギー分解能を実現する。中でも TES 型は,超伝導遷移端を高感度の温度 計として利用する次世代型検出器として最も注目されている。我々は将来の X 線天文衛星搭載を念頭に置き, 微小重力下で安定して極低温を実現する断熱消磁冷凍機 (ADR)をカロリメータと一体で開発している。昨 年は 5.9 keV の X 線に対し 3.8 ± 0.4 eV (FWHM)の分解能達成を報告した。その後,安定した素子評価 環境の実現を目指し,さらなる ADR の改善に努めてきた。

1 はじめに

1.1 X 線天文学

銀河団はダークマターの重力ポテンシャルによっ て数100~1000 もの銀河,1億度の高温プラズマが 閉じ込められた宇宙最大の天体で,宇宙年齢をかけ て小さな銀河団が衝突,合体を繰り返して形成して きた。これを観測的に知るためにはX線を放射する 高温プラズマの運動(100~km/s)をドップラー効果 によるエネルギーシフトによって捉え,放射体の運 動状態を調べることが必要である。しかし,その観 測には優れた分光性能を持ち,広がった天体であっ ても分光性能が劣化しないX線撮像検出器が必要で あり,この要求を満たすX線検出器として最も有力 なのがTES型(Transition-Edge-Sensor)型X線マ イクロカロリメータである。我々は,X線検出器と その動作のための極低温を実現する断熱消磁冷凍機 (ADR)を一体となって開発している。

1.2 X線マイクロカロリメータ

X線精密分光の要求性能を満たす検出器としては X線マイクロカロリメータがある。これは入射X線 光子1つ1つのエネルギーを素子の温度上昇として検 出し,0.1 K以下で動作させることで *E*/Δ*E* ~ 1000 のエネルギー分解能を実現する。図1はカロリメー タの模式図である。吸収体にX線光子が入射して起 こる僅かな温度上昇を読み取ることで,エネルギー を測定するというものである。吸収体で発生した熱 は熱浴へと流れ,再び熱平衡状態になる。





カロリメータに原理的なエネルギー分解能は,素 子の温度揺らぎと温度計のジョンソンノイズで決まっ ており,半値全幅(FWHM)は

$$\Delta E = 2.35 \sqrt{\frac{k_B T^2 C}{\alpha}} \tag{1}$$

と表され,式から熱容量 C は温度を下げると小さく なり,T, α に依存することがわかる。ここで α は温 度計の感度を示し,

$$\alpha = \frac{d\log R}{d\log T} \tag{2}$$

と定義される。従って,優れたエネルギー分解能を実現するためには極低温,高感度の温度計の利用が必要となる。我々が扱っている TES 型は,超伝導薄膜が常伝導から超伝導に遷移する際の急激な抵抗変化を高感度の温度計として利用しており,カロリメータのなかでも高感度である ($\alpha \sim 100 - 1000$)。数 \sim mK

の遷移端内に動作点を安定に保つため,定電圧バイ アスで動作させ強い負の電熱フィードバックをかけ て使用する。(図 2)



図 2: TES の R-T 曲線

2 断熱消磁冷凍機 (ADR)

2.1 概要

微小重力下でも安定して極低温環境を作り出すに は,重力依存性がない断熱消磁冷凍機(ADR)が最 も現実的である。ADRは常磁性体に磁場を印加させ て磁気エントロピーを下げ,磁化熱を排熱して断熱 消磁により冷却する。図3には我々が現在開発して いるクライオスタットの外観と模式断面,図4には エントロピーと温度の相関曲線,図5には,ADRの 構造とHe温度ステージの模式図を示した。

ADR クライオスタットは 40 cm×90 cm の小型 デュワー (300 K の真空容器),二重の蒸気冷却型放 射シールド,容量7 L の He タンクで構成されている (Shinozaki et al. 2012)。 冷却過程は,まず常磁性 体が熱的に熱浴と接した状態で励磁する (A→B)。次 に断熱状態にした後に熱浴と切り離して消磁するこ とで目標温度まで冷却する (B→C)。その後は温度保 持するように消磁し,その間検出器を動作させ X 線 を観測する (C→D)。現在の ADR は,磁化熱を排熱 して最低温度に到達するまでの時間 (~7時間)が観測 時間 (~20 時間) に対して非常に長い。これは, ADR の運転効率を低下させるため改善が要求される。

TES は超伝導遷移端を利用しており,磁場の影響 を受けやすいが, ADR は冷却過程で強磁場を発生さ せるため, TES 型カロリメータと ADR を一体のシ ステムとして動作環境を整えることが重要としてこ れまで開発を進めてきた。2014年にノイズ環境・検 出器周りの磁気シールドの改善によって,エネルギー 分解能 3.8 eV を実現した (小竹 2014)。



図 3: クライオスタットの外観と模式断面



図 4: エントロピーと温度の相関曲線



図 5: ADR の構造と He 温度ステージの模式図

2.2 温度制御

カロリメータが画期的な分解能を実現するには,動 作中に高い精度でセンサ温度を一定に保つ必要があ る。昨年度は温度安定度は 4-18 µKrms であったが, 4.1 先行研究の温度制御のプログラムを改良し,現在は 同様のセットアップで 1-2µKrms の温度安定度を達 成している。温度制御の詳細な結果は伊東 (2015) で 述べている。

3 エネルギー分解能評価

動作環境の評価に使用した TES 素子は首都大で 製作させた TMU146-4d である。これは 4×4 の 16 ピクセルでアレイ化されており,各単素子は 200µm 角の Ti(超伝導金属) と Au(常伝導金属)の二層薄膜 の上に 120µm 角の Au 吸収体が乗っている構造であ る。首都大希釈冷凍機上では 5.9 keV の X 線に対し 2.8 eV(FWHM)の性能が確認されている (Akamatsu et al. 2009)。

現在我々の ADR では, 3.8±0.2eV が確認されてい る。温度ゆらぎの改善によってエネルギー分解能の 安定度は高まったが,分解能の向上には至らなかっ た。温度安定度は十分改善したため,素子本来の性 能を制限しているのは温度安定度とは別の原因と考 えて,今後その点を明らかにしていく。



図 6: 取得したエネルギースペクトル図

4 排熱問題への原因追究

排熱問題の原因追究に向け,以下のことに取り組 んだ。

4.1 磁性体カプセル材料の計算

磁性体カプセルに使用されている材料の熱容量を 計算した。結果を図7に示す。排熱温度域ではSUS の熱容量が大きい結果を得た。これは材料として使 用しているSUS304は低温で磁性を帯びるため,最 大3Tの磁場印加がある排熱過程で,磁性による磁 気比熱の効果は無視できないためだと考えた。そこ で磁場中でSUS比熱を測定した。結果を図8に示す。 排熱時の温度域2-10Kで,磁場0T,3TのSUS比 熱の違いは小さく,SUSが長い排熱時間の寄与とし ては小さいことを突き止めた。



図 7: 磁性体カプセル材料の熱容量計算結果





4.2 排熱経路の温度分布

排熱経路の温度分布を較正温度計で確認した。温 度計を設置した場所は,検出器ステージ,ヒートス イッチの磁性体カプセル側(設置箇所A),ヒートス イッチの熱浴側(設置箇所B)の3箇所である(図9)。 ただし,温度計の読み出しは同時に2つまでしか行 えない。そこで,検出器ステージの温度は常時読み 出し,設置箇所A,Bはそれぞれ別日に測定した(A, B を測るために用いた温度計は同じ)。排熱時の温度 分布の結果を 10,11 に示した。励磁を終了した時間 を *x* 軸の原点にとっている。

検出器ステージの温度は 20150406 では ~2.5 K, 20150430 では~2.1 K であり,その差は~0.4 K であ る。一方でヒートスイッチ間では温度差が~0.8 Kの 温度差があり,ヒートスイッチ間で少なくとも~0.4 K の温度差があることを確認し,ヒートスイッチ間で 優位な温度差が生じていることを突き止めた。あわ せて,磁性体カプセルと検出器ステージの間で大き な温度差はないことも明らかになった。この結果を受 け,ヒートスイッチ表面を研磨し熱伝導度向上を図っ たが,排熱時間の問題解消にはつながらなかった。



図 9: 温度計の設置箇所



図 10: TES ステージと場所 A の温度分布 (150406)



図 11: TES ステージと場所 B の温度分布 (150430)

4.3 熱浴温度

熱浴温度が長い排熱時間の原因として,減圧用ポ ンプを排気量の大きいものに変更した。ポンプ変更 前と変更後の検出器ステージの温度分布を図12に示 した。熱浴温度は2Kを切り(~1.66K),従来のポン プに比べ熱浴温度は下がり排熱時間は実質短くなっ たが,排熱問題の根本的改善に至っていない。



図 12: 減圧用ポンプの違いによる排熱時間

4.4 まとめと今後

長い排熱時間の原因として,磁性体カプセル材料 の熱容量には大きな原因はなく,ヒートスイッチ間 に問題があると結論付けた。現在は,減圧用ポンプ を排気量の強力なものに変更し運転効率を高めてい るが,最適なヒートスイッチのシステムを再設計し, ヒートスイッチの接触熱抵抗を高めて,さらに排熱 時間を削減していく。

最後になりましたが,基礎物理学研究所および国 立天文台からのご支援に感謝いたします。このよう な機会を設けていただきありがとうございます。

Reference

- Frank Pobell,Matter and Methods at Low Temperatures,springer2006
- H.Akamatsu et al. 2009, AIPC 1185, 191

K.Shinozaki et al. 2008, SPIE 7011, 70113
R $\,$

- 橋元政哲,現場で生かす金属シリーズ ステンレス,工業調 査会,2007
- 谷津貴裕,修士論文「断熱消磁冷凍機を用いた X 線マイク ロカロリメータの動作環境の構築」,金沢大学,2012